



MPI STARGAZER シリーズ |

フォトリクステストシステム

システム概要

STARGAZERシリーズ フォトリクステストシステムで、テストの可能性を最大限に引き出しましょう。モジュール式のソフトウェアアーキテクチャに基づき、STARGAZERは柔軟に構成でき、特定のテスト要件に合わせてシームレスに統合可能です。

STARGAZERは、センシングレーザーやデータ通信レーザー、フォトダイオード、マイクロLEDなど、幅広いフォトリクスデバイスに対応しており、多様な用途に適応します。業界トップクラスのパートナーから提供される高品質な計測機器と統合された当システムは、正確かつ高性能なテストを実現します。

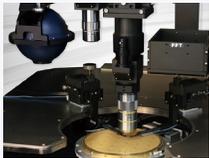
STARGAZERでテストプロセスを簡素化し、効率化しましょう。毎日、信頼性の高い正確な結果を提供します。今すぐ始めて、テストを次のレベルへ引き上げましょう。



STARGAZERモデルを探索

LD200-S

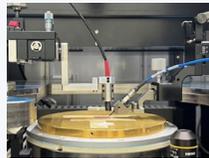
センシングレーザー



- リアルタイムの電流・電圧測定
- SMU、パワーメーター、ドライバーICの統合
- 高精度なスペクトル測定
- スペクトラムアナライザーまたは分光計の統合
- 広視野角 (FOV) を備えた近視野 (NF) レンズ
- NFPビームの品質を評価する解析ツール
- 可視光、NIR、IR範囲に対応する遠視野 (FF) レンズ
- FFPビームの品質を評価する解析ツール

LD200-D

データ通信レーザー



- SMUとパワーメーターの統合
- メーターを使用した電流・電圧測定
- スペクトラムアナライザーまたは分光計の統合
- 近視野 / 遠視野レンズの統合
- ビーム品質を計算するための解析ツール
- RFプローブと光VNAを使用したSパラメータ特性評価
- 相対強度雑音 (RIN) とビットエラーレート (BER) 試験のための試験機器統合

PD200

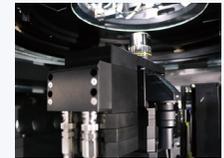
フォトダイオード



- 暗電流 / 光電流の測定
- 単体DUTおよびマルチDUTのテストのためのSMU統合
- 照明源制御 / 光スイッチ / アッテネーター制御
- LCR測定統合
- RFプローブと光VNAを使用したSパラメータ特性評価
- 相対強度雑音 (RIN) とビットエラーレート (BER) 試験のための試験機器統合

MT200

マイクロLED



- SMUとディスプレイドライバーの統合による精密な測定と制御
- 分光計、カラーメーター、および顕微鏡を統合し、カラーおよび照明パターンの解析を行います。
- 輝度と均一性を解析する専用ツール